



特許証  
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第6512649号  
(PATENT NUMBER)

発明の名称  
(TITLE OF THE INVENTION)

表面線量率の測定方法

特許権者  
(PATENTEE)

宮城県仙台市青葉区柏木1丁目2-38 柏木  
丁ビル4F

株式会社スリー・アール

発明者  
(INVENTOR)

茂木 道教  
菅井 弘

出願番号  
(APPLICATION NUMBER)

特願2018-157196

出願日  
(FILING DATE)

平成30年 8月24日(August 24, 2018)

登録日  
(REGISTRATION DATE)

平成31年 4月19日(April 19, 2019)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。  
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成31年 4月19日(April 19, 2019)

特許庁長官  
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

宗像直子

